Поиск светлых пятен

1 Задача:

Изначально задача ставится как выделение ярких пятен на изображении, каждый пиксель которого является комплексным числом и несет значения амплитуды и фазы принятого сигнала. В данной работе яркие пятна ищутся на основе только амплитудной части.

Соответственно требуется на монохромном изображении выделить светлые пятна - однородные яркие участки с резким изменением градиента яркости на границе. Ключевые слова для подобных алгоритмов - blob detection.

Имеется изображение $\{Z,\Phi\}$ - действительная и мнимая части. Оно преобразуется к $P:p_{i,j}=\sqrt{z_{i,j}^2+\phi_{i,j}^2}$ и строится алгоритм для поиска ярких пятен на изображении $P=\{p_{ij}\}, i=1,\ldots,m, j=1,\ldots,n$ где $p_{ij}\in B$ - яркость пиксела. Здесь $B\in\mathbb{R}_+$ - возможные значения яркости.

2 Алгоритм:

2.1 Описание:

Алгоритм должен получать на вход изображение P и, возможно, набор параметров. На выходе требуется получить бинарную матрицу R в которой единицам соответствуют центры найденных пятен.

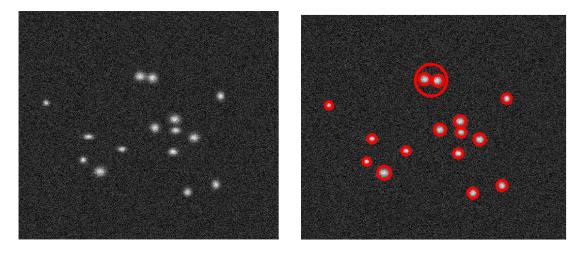


Рис. 1: Пример работы алгоритма.

Для нахождения светлых пятен воспользуемся одним из самых известных алгоритмов в данной области LoG-детектор [1] (Laplacian-of-Gaussian).В этом алгоритме производится свертка изображения со второй производной гауссианы и затем на получившемся изображении ищутся локальные минимумы. Они будут соответствовать светлым пятнам на изображении.

В предлагаемом алгоритме для поиска пятен различного размера вычисляется множество сверток изображения с масками с различным параметром. На всех свертках точки, соответствующие центрам ярких пятен, будут являться локальными минимумами. При этом минимальное значение яркости будет достигаться на свертке с маской с параметром равным радиусу светлого пятна.

Для устойчивости к шуму предлагается искать локальные минимумы минимумы на изображении \overline{conv} , которое определяется как $\overline{conv}(i,j) = \min_{k=1,\dots,k} (conv_k(i,j))$.

А также среди найденных пятен отсекаются те, интенсивность которых близка к интенсивности шумов.

2.2 Алгоритм:

Обозначения:

- Р входное изображение
- R матрица, совпадающая по размеру с P, с элементами $r_{ij} \in \{0,1\}$, в которой единицы соответствуют центрам ярких пятен.
- $oldsymbol{\cdot}$ ${f r}=(r_1,r_2,\ldots,r_k)$ набор возможных радиусов ярких пятен среди которых ведется поиск
- $G(x,y,\sigma)$ гауссиана с центром в (x,y) и параметром σ .
- $\hat{G}(x,y,\sigma)$ нормированная гауссиана: $\hat{G}(x,y,\sigma) = \sigma^2 G(x,y,\sigma)$
- $\nabla \hat{G}(x,y,\sigma)$ вторая производная нормированной гауссианы
- Conv = $(conv_1, \ldots, conv_k)$ множество сверток.

```
\mathbf{B}ход: P, \mathbf{r}
\mathbf{B}ыход: R
 1: R \leftarrow 0^{m \times n}
 2: // создаем набор сверток с различными масками
 3: для всех r_k в {f r}
        conv_k \leftarrow Convolution(P, \nabla \hat{G}(x, y, r_k))
 5: \overline{conv} \leftarrow min(conv_1, \dots, conv_k)
 6: для всех (i,j) в [1,\ldots,m] \times [1,\ldots,n]
        если (i,j) - точка локального минимума в \overline{conv} то
 7:
           R_{ij} \leftarrow 1
 9: // отбрасываем шумовые пятна
10: для всех (i,j) - центры пятен
        если \overline{conv}(i,j) > \operatorname{median}(\overline{conv}) + 0.1(\max_{(p,q)-blobs\_centers} \overline{conv}(p,q) - \operatorname{median}(\overline{conv})) то
12:
           R(i,j) = 0
```

2.3 Пошаговые примеры:

Пошаговые иллюстрации работы алгоритма на примере изображения с одним ярким пятном в центре и шумом интенсивностью 0.3 яркости пятна.

1. Изображение

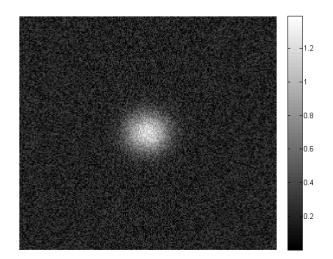


Рис. 2: Исходное изображение

2. Затем вычисляются свертки изображения с масками с различными параметрами:

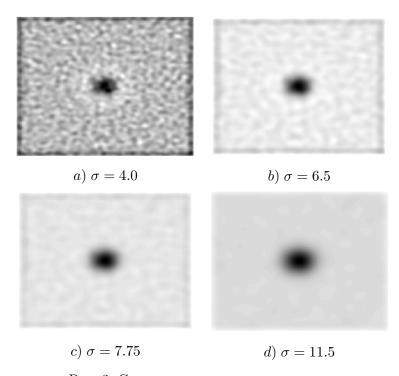


Рис. 3: Свертки с различными масками.

3. Вычисляется изображение - $\overline{conv}(i,j) = \min_{k=1,\dots,k}(conv_k(i,j)).$

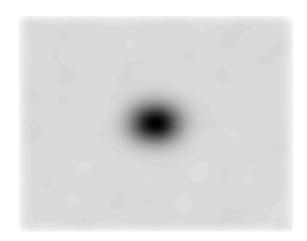


Рис. 4: $\overline{conv}(i,j)$

4. Ищутся локальные минимумы на этом изображении.

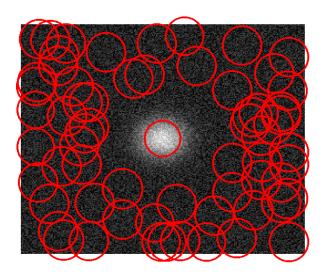


Рис. 5: Шумовые яркие пятна

5. Отфильтровываются шумовые пятна.

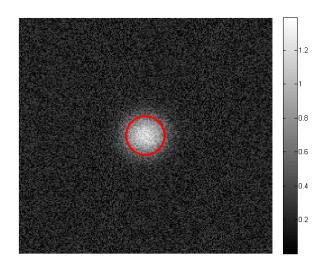


Рис. 6: $\overline{conv}(i,j)$

Список литературы

- [1] D. Marr and E.C. Hildreth. Theory of edge detection. Proc. Roy. Soc. London., B-207:187–217, 1980.
- [2] Krystian Mikolajczyk and Cordelia Schmid, Scale and affine invariant interest point detectors, International Journal of Computer Vision, pp. 63–86, 2004